

iSTART

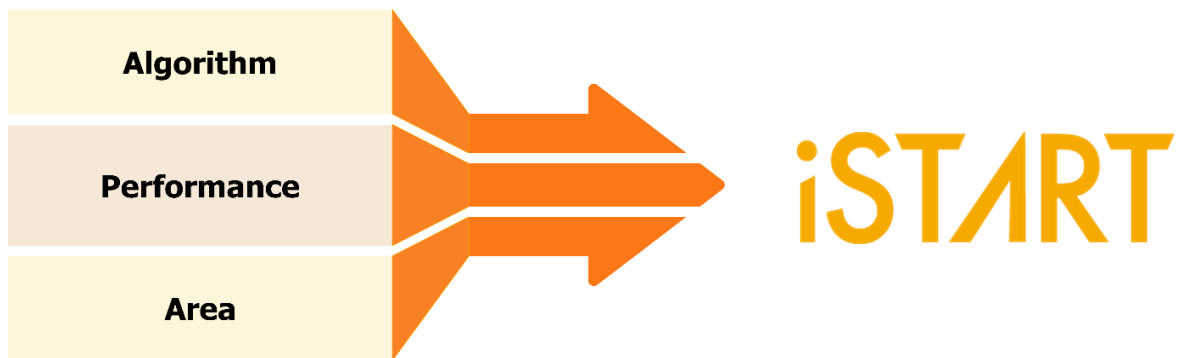
iReport

技術文件

使用者自定義測試演算法

隨著先進製程的應用越來越廣泛，舉凡高效能運算（HPC, High Performance Computing）晶片、人工智慧晶片、邊緣運算晶片與影像處理晶片等，都需要使用先進製程。但是，記憶體的使用在先進製程下，產生動態失效（Dynamic fault）的機率增加。芯測科技推出全世界第一套完全以圖形介面為主（GUI-Based）的使用者自定義演算法（UDA, User Defined Algorithm）微架構。

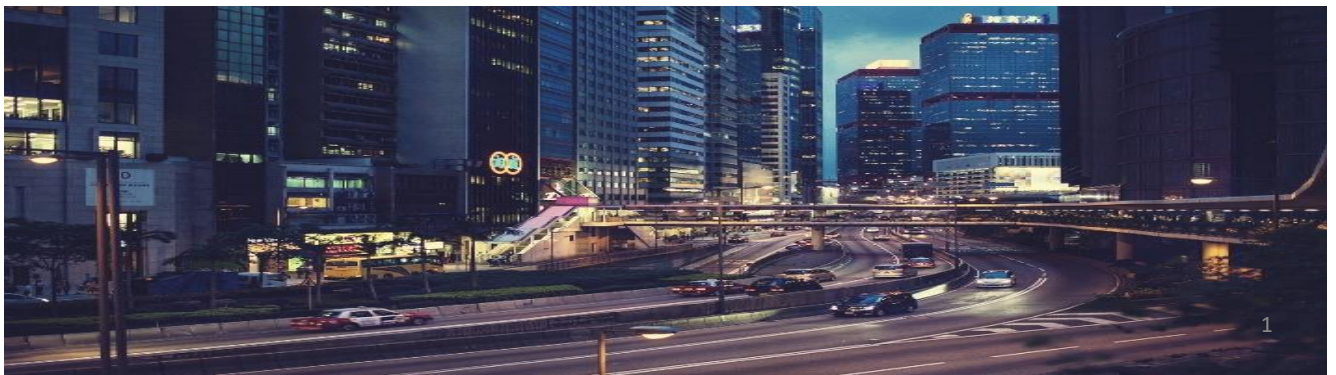
[Read More +](#)



芯測科技的車用電子解決方案

隨著科技的持續發展，微處理器、記憶體、晶片、感測器的數量，以及配置電腦控制平台、GPS系統、影像設備、通訊設備的比率也逐年提升，放眼現今全球汽車大廠爭相投入研發的方向，目的都是如何生產更安全與更環保的高科技車輛，並提供更多舒適性及方便性。芯測科技提出車用電子的解決方案如下：

[Read More +](#)



iSTART

iReport

新聞

[News] 芯測科技發表使用者自定義測試演算法 提高測試精準度

芯測科技所推出的『使用者自定義測試演算法（User Defined Testing Algorithms）』微架構，提供了高度彈性化與簡單化的使用環境，採用GUI的操作環境，讓使用者可以輕鬆的定義出定製化的記憶體測試演算法。[Read More +](#)

[News] 就靠它！順利解決半導體代工廠漲價衝擊

聯陽半導體導入亞洲唯一專注於記憶體測試與修復廠-芯測 EDA工具START™，作為聯陽開發各項晶片時，記憶體測試與修復電路設計的標準流程與關鍵工具。[Read More +](#)

[News] 元宇宙夯 芯測科技扮演關鍵性角色

隨著科技的持續發展，高性能運算晶片與影像處理晶片逐年提升，芯測科技的解決方案可望為晶片開發商帶來快速、省成本且高效能的服務。[Read Here +](#)

線上研討會

iSTART's User Defined Testing Algorithms for HPC and ISP Chip 透過「使用者自訂測試演算法（User Defined Testing Algorithms）」微架構，晶片製造商可以自行設計出最符合晶片的記憶體測試演算法，在降低DPPM的同時，也可以兼顧到測試的成本極大降低。[Watch Now +](#)

iSTART's START v3 for Automotive applications，全方位分享芯測科技在車用晶片上的測試與修復解決方案 START v3可搭配專屬的微架構，嚴格管控車用晶片的安全性，讓車用晶片無後顧之憂。[Watch Now +](#)